

2020 年 10 月 1 日

各 位

双日株式会社

双日向三维形状测量解决方案提供商 XTIA 追加投资
～ 着手联合开发检测平台 ～

株式会社 XTIA^{※2)} (公司原名：株式会社光梳，以下简称“XTIA”) 是全球唯一一家应用诺贝尔物理学奖获奖技术“光学频率梳”^{※1)} 成功商品化的技术开发企业。双日株式会社(以下简称“双日”)接受该公司的定向增资要求并出资^{※3)}，利用从该公司检测设备获得的数据推动构建检测平台。

第四次工业革命（工业 4.0）的建设逐年递增，获取和利用有效的制造测量数据则变得尤为重要。到目前为止，XTIA 收到很多以检测工艺自动化为目标的客户咨询，引入 XTIA 提供的非接触式三维形状测量仪器后，是否可以提供管理且使用设备数据的人力资源。

为了解决这些问题，双日和 XTIA 决定共同开发一个不是专家也可以轻松管理和使用测量仪器数据的专用检测平台。本轮投资的资金，将建立一个新的软件开发团队，以加速测试平台的构建。通过这种方式，旨在解决制造业中人力资源短缺的问题，并提供检测过程全自动化的整体解决方案。

通过本次投资，双日和 XTIA 建立了比以往更加坚固的合作伙伴关系，并将双日质量检测业务与 XTIA 拥有的光学技术相结合，开创新服务，普及自动化检测过程，并推动第四次工业革命进程。

※1) XTIA 是全球唯一一家应用诺贝尔物理学奖获奖技术“光学频率梳”成功商品化，具有独创性和高科技能力的技术开发企业。开发和完善光学频率梳作为一种测量方法，满足现场测量和检测自动化需求，并为实现第四次工业革命做出贡献。我们与各公司合作，开发、销售实现自动检测的检测装置，提供光学频率梳技术作为测定方法等。

※2) 光学频率梳技术以 2005 年获得诺贝尔物理学奖的“史上精度最高的尺子”为原理，XTIA 是全球唯一一家将其成功运用在产业中的公司。

有关产品和技术的详细信息，请访问以下链接。

<https://www.optocomb.com/product/>

※3) 请参考本公司于 2020 年 2 月 21 日发布的新闻「双日出资大型 3D 形状测量公司 XTIA」。两次的总投资额为 5 亿日元。

完

(参考资料)

【XTIA 公司概况】

公司名称	株式会社 XTIA
成立时间	2002 年 4 月
地址	东京都品川区东品川 3-32-42 IS 大厦 2F
代表人	代表董事社长 八木 贵郎
主要业务内容	光学频率梳发生器及其应用等相关设备的开发和销售